



E-Actu n°34 : Actualités du Département « Instrumentation Scientifique – MILEXIA FRANCE »

Nouveaux équipements dans notre laboratoire de démonstration

Nous nous efforçons de toujours vous faire bénéficier dans notre laboratoire de démonstration des équipements de pointe de dernière génération. Nous choisissons ces systèmes avec soin dans notre gamme en espérant qu'ils répondront à vos attentes.

Pour cette rentrée 2019, nous allons recevoir le dernier profilomètre optique 3D de Sensofar, le S Neox.

N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour une démonstration ou un prêt d'équipement.

Pour les plus gros équipements, nous avons mis en place des partenariats avec plusieurs laboratoires publics et privés et nous pouvons solliciter nos fournisseurs, leurs équipements et leurs spécialistes.

Nous disposons également des systèmes suivants :



Profilomètre optique 3D sans contact SENSOFAR S Neox



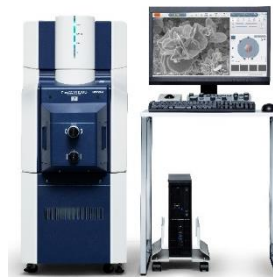
Nettoyeur plasma ex-situ IBSS Chiaro



MEB de table Hitachi TM4000Plus



Nettoyeur UV Hitachi ZONE SEM



MEB compact Hitachi FlexSEM1000

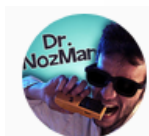


Nettoyeur plasma in-situ IBSS GV10x

Dr NOZMAN

Après la visite dans nos locaux à Verrières le Buisson du YouTuber Dr NOZMAN, vidéaste spécialisé dans la vulgarisation scientifique, nous lui avons prêté notre MEB de table Hitachi TM4000Plus pendant quelques semaines. De nombreuses vidéos sortiront à partir de septembre.

N'hésitez pas à vous abonner sur sa chaîne YouTube ou à notre page LinkedIn pour suivre ses futurs vidéos.



Dr Nozman ✓
3 283 002 abonnés



JE TESTE L'APPAREIL LE PLUS FOU DU MONDE !...

971 k vues • il y a 1 mois



MILEXIA France renforce son équipe

Le Département d'Instrumentation Scientifique a recruté un nouvel ingénieur :

- **Bo JIANG**, Ingénieur de Maintenance. Il nous a rejoint au début du mois d'août et sera en charge en priorité des MET et des MEB, des équipements de préparation ainsi que des profilomètres optiques.

Bienvenue dans l'équipe 😊

Formation CNRS Cryo-MEB pour la matière molle : préparation des échantillons, observation et analyse

Organisée du **8 octobre au 10 octobre 2019** à l'**Institut Charles Sadron** à **Strasbourg**, cette formation a pour but de :

- Connaître les diverses méthodes de congélation d'échantillons solvatés et les méthodes standards de préparation d'échantillons
- Savoir préparer un échantillon en solvants aqueux et organique
- Découvrir l'utilisation du système cryo MEB disponible
- Découvrir les conditions optimales pour l'observation sous le faisceau électronique
- Savoir reconnaître les artéfacts de préparation les plus courants



Avec des cours théoriques (5h) et beaucoup de travaux pratiques (12h), cette formation conviendra à toute personne souhaitant **s'initier à la cryo-microscopie** et ayant des bases en MEB ainsi que toute personne souhaitant **caractériser par cryo MEB des échantillons de type matière molle**.

Intervenants : M. SCHMUTZ, A. CARVALHO (ICS) et A. BONNOTTE (ICB)

Pour plus d'informations et pour vous inscrire, cliquez [ici](#)

Évènements à venir

23 au 26 septembre 2019 **ESREF** – Centre de congrès Pierre Baudis, Toulouse

L'ESREF organise son 30^{ème} Symposium Européen sur la Fiabilité des Dispositifs Electroniques, la Physique de Défaillance et l'Analyse au centre de Congrès Pierre Baudis, à Toulouse. Ce symposium international se concentre sur les développements récents et les orientations futures en matière de gestion de la qualité et de la fiabilité des matériaux, des dispositifs et des circuits pour la micro, la nano et l'optoélectronique. Nous accompagnerons **Hitachi Power Solutions** lors de cet évènement.

24 au 26 septembre 2019 **CIM** – Porte de Versailles, Paris

Le Congrès International de Métrologie rassemble biennalement tous les acteurs dans le domaine métrologie. Il s'agit à la fois d'un congrès sur les évolutions des technologies et processus de mesure et d'un lieu de rencontre entre industriels, experts et scientifiques.

Nous exposerons : un **profilomètre optique 3D S neox SENSOFAR** et un **MEB de table TM4000Plus HITACHI**. Un **expert en profilométrie de SENSOFAR** et un **expert en microscopie à force atomique d'HITACHI** seront présents.

Nous vous invitons à nous rejoindre sur notre stand **Milexia France H51**... des **surprises** vous attendent.

Les inscriptions sont gratuites, n'hésitez pas à créer votre badge à partir de ce lien : [CREER VOTRE BADGE GRATUIT !](#)

